



**ESSENT
OPTICS**

OUTSTANDING SPECTRAL MEASUREMENTS OF OPTICAL COATINGS

PHOTON RT 7512

LWIR SPECTRAL MEASUREMENTS OF PLANO OPTICS AND PRISMS



SPECIFICATIONS

PARAMETER	DESCRIPTION
MODEL	7512
OPTICAL CONFIGURATION	
Photometric functions	%T, %R
Effective wavelength range, μm	7,5 - 12,5
Built-in polarizers, μm	7,5 - 12,5
Optical scheme of monochromator	Czerny-Turner
Optics	Mirror: Au, Lenses: ZnSe + AR
Measurement of Transmission	Variable angle measurements: 0 - 60 deg angles of incidence
Measurement of Reflection	Interchangeable sample stages with fixed angles of incidence: 10, 30, 45 and 60 deg Reference sample: gold mirror
Turning pitch angle of sample stage	0,01 deg
Beam displacement compensation, mm	40
Unattended polarization measurements with built-in polarizers	S, P, (S+P)/2
Wavelength sampling pitch, nm	0,5 - 100,0
Spot size on measured sample, mm	6,0 x 3,0
Ultimate spectral resolution, nm	8 (non-polarized light)
Wavelength accuracy, nm	3,6
Wavelength repeat accuracy, nm	+/- 0,9
Photometric accuracy	+/- 0,2 % (47% T, $\lambda_0 = 10,6\mu\text{m}$, AOI = 3°)
Photometric repeat accuracy	+/- 0,1 %
Stability of baseline (UV-VIS), %/hour*	+/- 0,3 %
Light sources	IR lamp HgAr wavelength calibration verification lamp
SAMPLE COMPARTMENT	
Maximum sample size, mm	150 x 200
Maximum sample thickness, mm	40
Planar sample stage	For measurement of transmission and reflection of planar samples with size bigger than 12 x 10 mm
Synchronized positioning	Synchronized computer controlled positioning for sample stage and photodetectors unit depending on the chosen photometric function
INTERFACE, DIMENSIONS AND WEIGHT	
Interface	USB 2.0
Power consumption, Watt	110
Power input	110 - 220 VAC, 50 - 60 Hz
Width x Depth x Height, mm (inches)	760 x 340 x 370 (30" x 13,39" x 14,57")
Net weight, kg (lbs)	51 (112)

* after 1 hour warm-up time



東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS

本社: 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.I.ビル ☎03-3686-4711
大阪営業所: 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル ☎06-6393-7411
☒ <https://www.tokyoinst.co.jp> ☒ sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company – グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供 –



超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡
高速分光測定装置、クライオスタット



Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー
OPOLレーザー



Enviro ESCA (準大気圧XPS)
ARPESなど

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。(製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです)
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。